

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年 5月22日現在

機関番号:13903
研究種目: 若手研究(B)
研究期間: 2010~2012
課題番号: 22740223
研究課題名(和文)高性能強磁性トンネルバリアの開発とトンネル型スピンフィルター効果の
実現
研究課題名 (英文) Development of high quality ferromagnetic tunnel barrier and
realization of tunneling spin filter devices
研究代表者
田中 雅章(TANAKA MASAAKI)
名古屋工業大学・工学研究科・助教
研究者番号: 50508405

研究成果の概要(和文):

本研究ではパルスレーザー堆積法を用いて作製した垂直磁気異方性を有する CoFe₂O₄ 薄膜に よるトンネル型スピンフィルター効果の実現を目指した.トンネル型スピンフィルター効果に 用いるにはドロップレットが少ない平坦な強磁性絶縁体薄膜の作製法の確立が重要である.本 研究ではシャドウマスクを用いることで基板上への大きな粒子の付着を低減させることに成功 した.シャドウマスクを用いて MgO(001)基板上に製膜した垂直磁気異方性を有する CoFe₂O₄ 薄膜の作製条件の探索を行った.最適条件で FePd/MgO/CoFe₂O₄ を基本構造とする磁気トンネ ル接合素子を作製し,磁気抵抗測定を行ったところ,300 K で 0.7%,5 K で 16.5%の磁気抵抗 比が得られ,室温におけるトンネル型スピンフィルター効果を示唆する結果が得られた.

研究成果の概要(英文):

In this study, tunneling-spin filtering effect of ferromagnetic insulator $CoFe_2O_4$ with perpendicular magnetic anisotropy was studied. To improvement surface flatness of $CoFe_2O_4$ films, the films were grown on MgO(001) substrates by pulse laser deposition method with a shadow mask. The $CoFe_2O_4$ films without droplet formation with perpendicular anisotropy energy density of 2.36×10^6 erg/cm³ were obtained. Magnetoresistance measurements were carried out for magnetic tunnel junctions (MTJs) using MgO/CoFe₂O₄ and ferromagnetic metal L10-type FePd electrodes fabricated on MgO (001) substrates. The tunnel magnetoresistance ratio of 0.7% at 5 K and 16.5% at 300 K was obtained for the MTJs.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2010年度	1,600,000	480,000	2,080,000
2011 年度	600,000	180,000	780,000
2012 年度	600,000	180,000	780,000
総計	2,800,000	840,000	3,640,000

交付決定額

研究分野:数物系科学

科研費の分科・細目:物理学・物性Ⅱ

キーワード:スピントロニクス、コバルトフェライト、トンネル型スピンフィルター効果

1. 研究開始当初の背景

従来のエレクトロニクスでは、主に電子が 持つ電荷だけが利用されてきた.近年,電子 が持つスピン自由度の利用を目指したスピ ントロニクスに関する研究が注目されてい る. スピントロニクスデバイスの発展にはス ピン状態が偏極した電子(スピン偏極電子)を 効率的に非磁性体に注入する「スピン注入源」 の開発は重要である. 強磁性金属をスピン注 入源とした場合、電気伝導率のミスマッチが 大きい半導体ヘスピン注入を試みると、スピ ン情報がほとんど消失する.そのため、新し いスピン注入法の開拓が必要である. 電気伝 導率の違いに影響を受けないスピン注入源 として, 強磁性絶縁体を用いたトンネル型ス ピンフィルター効果が有望とされている.ト ンネル型スピンフィルター効果とは、強磁性 絶縁体の障壁の高さが、電子がもつスピン自 由度により異なるために、片方のスピンをも つ電子のみが通過する効果である. これまで 国内外で EuS やコバルトフェライト (CoFe₂O₄), La_{0.1}Bi_{0.9}MnO₃などのトンネル型ス ピンフィルター効果が観測されており、室温 でのトンネル型スピンフィルター効果の観 測も報告されているが、これまでに観測され たトンネル型スピンフィルター効果はすべ て面内磁化を持つ強磁性絶縁体薄膜を用い ている.

CoFe₂O₄ はバルク体のキュリー温度が室温 より十分に高いフェリ磁性体であり、数 nm 程度の薄膜の場合でも室温以上のキュリー 温度を示すことが期待できる.また、 MgO(001)上に、パルスレーザー堆積(PLD)法 を用いて製膜した CoFe₂O₄は、作製時の酸素 圧や基板温度などの条件を最適化すること で(001)方向にエピタキシャル成長し、また垂 直磁気異方性を示すことが知られている.

2. 研究の目的

本研究では垂直磁気異方性を持つ強磁性 絶縁体薄膜によるトンネル型スピンフィル ター効果の実現を目的とした.そのために本 研究ではPLD法を用いて表面平坦性,垂直磁 気異方性の良い CoFe₂O₄薄膜の作製法の確立 を目指した.次に最適製膜条件でトンネル型 スピンフィルター効果検証用の磁気トンネ ル接合(MTJ)素子の作製を行い,トンネル磁 気抵抗効果の観測からトンネル型スピンフ ィルター効果の実証を目指した.

3.研究の方法

本研究では PLD 法を用いて垂直磁気異方 性を有する CoFe₂O₄ 薄膜の MgO(001)基板上 への製膜条件の探索を行った. PLD 法を用い た成膜では,組成のズレ等が少なく高品質な 酸化物薄膜の作製が可能である一方で,レー

ザーによりターゲットから未分解で粒径の 大きな材料が多く飛ばされる. これらの未分 解の粒子は基板表面にドロップレットが生 成される原因である. ドロップレットが多く 存在するトンネル型スピンフィルター素子 では、ピンホールが原因のリーク電流が多く なりスピン注入効率が極端に悪化する. そこ で、本研究では、ターゲットと基板の間にシ ャドウマスクを配置し,ドロップレットの生 成の抑制を試みた.シャドウマスクを用いる ことで、レーザーでターゲットから直接飛ば される材料を遮断し,周囲の酸素分子との衝 突によりシャドウマスクの背後に回りこむ 完全に分解された材料のみを製膜に用いる. この方法でドロップレットの減少が期待で きる.シャドウマスクは1枚の金属板で構成 した平面型シャドウマスクの他に、図1に示 す立体構造を持つものを使用した. これによ り酸素分子との衝突により回り込んだ材料 が,均一に基板に付着し,基板全体での膜厚 のむらをへらすことが期待できる. CoFe₂O₄ 薄膜の作製条件と表面平坦性、結晶性、垂直 磁気異方性等を調べるために, MgO(001)単結 晶基板に CoFe₂O₄ 単層膜を作製した. CoFe₂O₄ 単層膜は、5~20 Paの酸素雰囲気中で、基板 加熱を行い, YAG 2 倍波レーザーを用いた PLD 法で作製した. ターゲットは市販の焼結 体を用いた. CoFe₂O₄ 作製した試料は, 原子 間力顕微鏡(AFM)による表面平坦性の評価, X 線回折装置による結晶構造解析及び SOUID 磁束計による磁化測定を行った.

次に CoFe₂O₄薄膜のトンネル型スピンフィ ルター効果の効率を評価するために,強磁性 金属を参照層とする MTJ 素子を作製し,その トンネル磁気抵抗効果の測定を行った. CoFe₂O₄ 単層膜の評価から得られた条件を元 にトンネル型スピンフィルター効果の評価

を行った.トンネル型スピンフィルター効果 のスピン注入効率を直接評価するのは難し



Fig. 1 立体型シャドウマスク.

い. そのために、非磁性絶縁体 MgO を



Fig. 2 本研究で作製した FePd(21.5 nm)/MgO(1 nm)/CoFe₂O₄(5 nm)を基本構 造とする磁気トンネル接合素子.

CoFe₂O₄層と強磁性金属 L1₀型 FePd 層で挟ん だ図2に示すMTJ素子用の多層膜を作製した. 下部強磁性電極に用いたL1₀型FePd層は超高 真空蒸着器を用いた原子層交互蒸着法によ り作製した. L1₀型 FePd は作製条件により垂 直磁気異方性を持つ.また,非磁性絶縁体 MgO を CoFe₂O₄層と強磁性金属 L1₀型 FePd 層の間に挿入することで、上下の強磁性層間 の磁気的相互作用を低減し、磁化の平行・反 平行状態を実現することができる.また MgO 層の上に製膜される CoFe₂O₄層が垂直磁気異 方性を有することが期待される.多層膜を作 製した後に、コンタクトアライナーを用いた フォトリソグラフィー及びアルゴンイオン ミリング装置を用いた微細加工により,数マ イクロメートルの大きさの MTJ 素子を作製 した. 作製した MTJ 素子は物理特性測定装置 PPMS 及びソースメーターを用いて2Kから



Fig. 3 立体型のシャドウマクスを用いて
 作製した CoFe₂O₄ 単層膜の X 線回折.



Fig. 4 (a)シャドウマスクなし及び(b)立体
 型シャドウマスクを使用して作製した
 CoFe₂O₄単層膜の AFM 像.

300 K の範囲で電流電圧測定及び磁気抵抗測 定を行った.

4. 研究成果

MgO(001)単結晶基板上に立体型のシャド ウマスクを用いて酸素圧 5.0 Pa で作製した CoFe₂O₄単層膜の X 線回折の結果を図 3 に示 す.これらの結果から,成膜温度 200℃,300℃ で製膜した CoFe₂O₄単層膜は 001 方向にエピ タキシャル成長することがわかる.また,膜 面垂直方向の格子定数を評価したところ,バ ルクの値である 8.38 Å よりも短くなってい ることが分かった.また,CoFe₂O₄(008)にお ける半値幅はいずれも 1°程度であった.

図 4(a)にシャドウマスクを使用しないで酸 素圧 2.0 Pa, 基板温度 400℃で製膜した CoFe₂O₄ 単層膜,図4(b)に立体型シャドウマ スクを使用して酸素圧 5.0 Pa, 基板温度 300℃ で製膜した CoFe₂O₄ 単層膜の AFM 像を示す. シャドウマスクを使用しないで製膜した試 料では、大きさや形状が不定形の粒子が多く 存在している.これらはレーザーにより飛ば された未分解の材料に起因するドロップレ ットであると考えられる.一方,図4(b)に示 す立体型のシャドウマスクを用いて製膜し た試料の AFM 像では大きなドロップレット がほとんど存在していない. このことから, シャドウマスクを用いることでドロップレ ットを減少させることが可能である事がわ かる.この試料では、平均表面粗さは0.2 nm 程度と良好であった.また、図1のような立 体型のシャドウマスクではなく,1枚の金属 板のみの平面マスクを用いた場合は、MgO 基 板の中心付近に CoFe₂O₄ 単層膜が製膜されな



い. 一方で立体型のシャドウマスクを用いて 作製した試料は基板全体にほぼ均一に製膜 されている. このことから, PLD 法による CoFe₂O₄ の製膜において立体型のシャドウマ スクの使用は、ドロップレットの生成を低減 し、かつ均一な薄膜の作製に有用であること がわかった.

図5に立体型シャドウマスクを用いて酸素 圧5.0 Pa, 基板温度300℃で製膜したCoFe₂O₄ 単層膜の面内方向及び膜面垂直方向に対す る磁化測定の結果を示す.面内方向及び膜面 垂直方向に磁場を印加した際のヒステリシ スループを比較すると,MgO基板上の CoFe₂O₄単層膜は垂直磁気異方性を有する事 がわかる.ヒステリシスループから求めた垂 直磁気異方性エネルギーは2.36×10⁶ erg/cm³ 程度であることがわかった.

以上のように PLD 法で立体型のシャドウ マスクを使用して製膜することで,垂直磁化 型のトンネル型スピンフィルター素子とし て利用できる表面平坦性,垂直磁気異方性を 有する CoFe₂O₄ 単層膜を製膜することが可能 であることがわかった.



Fig. 6 FePd/MgO/CoFe₂O₄構造の磁気ト ンネル接合素子の電流電圧測定の結果.



抗測定.

図6にFePd/MgO/CoFe₂O₄/Auを基本構造とした MTJ 素子の電流電圧測定の結果を示す. 結果から明確な3次曲線が得られることから, 比較的良好なバリアが得られた事がわかる. これはシャドウマスクを持ちることで表面 平坦性が改善され,強磁性絶縁体層の絶縁性 が改善されたことが考えられる.

図 7 に 300 K で 100 mV 印加した時の FePd/MgO/CoFe₂O₄/Au の MTJ 素子の磁気抵 抗効果を示す.この結果から,小さいものの 外部磁場に依存した抵抗の変化が見られる. 磁気抵抗測定から 300 K で 0.7%,および 5 K で 16.5%程度の磁気抵抗効果が得られた.以 上のように本研究において垂直磁気異方性 を持つ強磁性絶縁体 CoFe₂O₄ 薄膜を用いて室 温でトンネル型スピンフィルター効果を示 唆する結果が得られた.

5. 主な発表論文等

〔学会発表〕(計1件) 奈木南,中川浩次,<u>田中雅章</u>,壬生攻,「Studies on spin-filtering CoFe₂O₄ layers for room-temperature TMR effect",」応用物理学 会スピントロニクス研究会・若手研究会, 平成 24 年 12 月 11 日,札幌.

6.研究組織
(1)研究代表者
田中 雅章(TANAKA MASAAKI)
名古屋工業大学・工学研究科・助教研究者番号:50508405
(2)研究分担者
該当なし
(3)連携研究者
該当なし